



Title of Change:	TSSOP 16 Additional Assembly and Test Site (AUTO PARTS)	
Proposed Changed Material First Ship Date:	13 Jan 2022 or earlier if approved by customer	
Current Material Last Order Date:	N/A <i>Orders received after the Current Material Last Order Date expiration are to be considered as orders for new changed material as described in this PCN. Orders for current (unchanged) material after this date will be per mutual agreement and current material inventory availability.</i>	
Current Material Last Delivery Date:	N/A <i>The Current Material Last Delivery Date may be subject to change based on build and depletion of the current (unchanged) material inventory</i>	
Product Category:	Active components – Integrated circuits	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or logic.fpcn@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <PCN.samples@onsemi.com> . Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Sample Availability Date:	N/A	
PPAP Availability Date:	N/A	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Chielo.Basa@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. The change will be implemented at 'Proposed Change Material First Ship Date' in compliance to J-STD-46 or ZVEI, or earlier upon customer approval, or per our signed agreements. ON Semiconductor will consider this proposed change and it's conditions acceptable, unless an inquiry is made in writing within 45 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com .	
Change Category		
Category	Type of Change	
Test Flow	Move of all or part of electrical wafer test and/or final test to a different location/site/subcontractor	
Equipment	Production from a new equipment/tool which uses the same basic technology (replacement equipment or extension of existing equipment pool) without change of process.	
Process - Assembly	Move of all or part of assembly to a different location/site/subcontractor., Change of direct material supplier, Change of product marking	
Description and Purpose:		
Qualify new sub contractor site to increase capacity. After FPCN matures, parts will be supplied from either site. All the BOM material is the same from both site. C194 is the same material as A194.		
	Before Change Description	After Change Description
Assembly and Test Site	ON Semiconductor Carmona, Philippines	ON Semiconductor Carmona, Philippines or ATEC - Automated Technology, Philippines
LeadFrame	C194 TSSOP 16 NiPdAu	C194 TSSOP 16 NiPdAu or A194 TSSOP 16 HD, NiPdAu



	Existing Site	New Site		
Product marking change	ASSEMBLY CODE: "P" 	ASSEMBLY CODE: "Y"  No change in marking style. The only difference is the assembly code		
Reason / Motivation for Change:	Source/Supply/Capacity Changes			
Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:	The device has been qualified and validated based on the same Product Specification. The device has successfully passed the qualification tests. Potential impacts can be identified, but due to testing performed by ON Semiconductor in relation to the PCN, associated risks are verified and excluded. No anticipated impacts.			
Sites Affected:				
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites		
ON Semiconductor Carmona, Philippines		ATEC - Automated Technology, Philippines		
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Assembly Code will be different for parts from new site.			
Reliability Data Summary:				
QV DEVICE NAME: NLVHC4051ADTR2G RMS: O62338 PACKAGE: TSSOP 16				
Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/693
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 45
PD	JESD22-B100 and JESD22-B108	Per Case Outline		0/30
Electrical Characteristics Summary:				
Electrical characteristics available upon request.				

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Current Part Number	New Part Number	Qualification Vehicle
NLV74HC138ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC139ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHCT4851ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4851ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4094BDTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4060ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHCT366ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4852ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC589ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4538ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC4020ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC259ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC238ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC151ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC365ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC175ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC157ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC4052ADTRG	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4051ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC165ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC595ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4052ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHCT4852ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4053ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC174ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HCT366ADTRG	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HCT4051ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号 : FPCN23730Z

発行日 : 13 Jul 2021

変更件名:	TSSOP 16 組立およびテストサイトの追加(車載用部品)
初回出荷予定日:	13 Jan 2022 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前
現在の材料の最終注文日:	N/A 既存品の最終注文日以降の注文は、この PCN に記載されている変更後品の注文とみなされます。この日付より後の既存品(変更前品)の注文は、相互契約により変更前品の在庫状況に応じて履行されます。
現在の材料の最終出荷日:	N/A 既存品(変更前品)の最終出荷日は、変更前品の製造および在庫の状況によって変更されることがあります。
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント – 集積回路
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または logic.fpcn@onsemi.com にお問い合わせください。
サンプル:	サンプルの注文または PCN.samples@onsemi.com を注文するには、お近くの ON Semiconductor 営業所にお問い合わせください。 サンプルのリクエストは、この変更通知の公開後 45 日以内に提出してください。 サンプルの納品時期は、リクエスト日、サンプル数量、特別なお客様の梱包/ラベルの要件に従います。
サンプル提供開始可能日:	N/A
PPAP 提供開始日:	N/A
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または Chielo.Basa@onsemi.com にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。 FPCN は、変更実施の 12 か月前、またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前に発行されることがあります。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 45 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更希望およびその条件が受諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com をお願いします。
変更カテゴリ:	変更種別
テスト フロー	ウエハ テストおよび/または最終テストのすべてまたは一部の異なる場所 / 拠点 / サブコンへの移動
装置	プロセス変更をともなわない同じ基本技術を使用した新しい機器/機材 (機器の交換または既存機器プールの拡張) での生産。
プロセス – 組み立て	組み立てのすべてまたは一部の異なる場所 / 拠点 / サブコンへの移動 直接材サプライヤの変更 製品捺印の変更

説明および目的:

生産能力を増強するために、新しいサブコン拠点を認定します。FPCN 期限後に、製品はいずれかの拠点から供給されます。すべての BOM 素材は両拠点で同じです。C194 は A194 と同じ素材です。

	変更前の表記	変更後の表記
アセンブリ および試験の拠点	ON Semiconductor Carmona, Philippines	ON Semiconductor Carmona, Philippines or ATEC - Automated Technology, Philippines
リードフレーム	C194 TSSOP 16 NiPdAu	C194 TSSOP 16 NiPdAu or A194 TSSOP 16 HD, NiPdAu



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号 : FPCN23730Z

発行日 : 13 Jul 2021

	既存の拠点	新拠点		
製品表示変更	組み立てコード: 「P」 	組み立てコード: 「Y」  マーキングスタイルに変更はありません。組み立てコードが異なるだけです。		
変更の理由 / 動機:		供給元/サプライ/能力の変更		
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響		デバイスは同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。デバイスは認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性があります。オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証および排除されます。 予想される影響はありません。		
影響を受ける拠点:				
オン・セミコンダクター拠点:		外部製造工場 / 下請業者拠点:		
ON Semiconductor Carmona, Philippines		ATEC - Automated Technology, Philippines		
部品の表示 / 変更の追跡可能性:		新拠点からの部品の組み立てコードは異なるものになります。		
信頼性データの要約:				
デバイス名: NLVHC4051ADTR2G RMS : O62338 パッケージ : TSSOP 16				
テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/693
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 45
PD	JESD22-B100 and JESD22-B108	Per Case Outline		0/30
電気的特性の要約:				
電気的特性はご要望に応じてご提出いたします。				



影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールの顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

現在の部品番号	新部品番号	認定試験用ピークル
NLV74HC138ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC139ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHCT4851ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4851ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4094BDTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4060ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHCT366ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4852ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC589ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4538ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC4020ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC259ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC238ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC151ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC365ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC175ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC157ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC4052ADTRG	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4051ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC165ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC595ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4052ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHCT4852ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLVHC4053ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HC174ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HCT366ADTRG	NA	NLVHC4051ADTR2G
NLV74HCT4051ADTR2G	NA	NLVHC4051ADTR2G